

JIS見直し(案)(電子分野)

資料2

【認定機関としての対応案】

個別No.	規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、廃止又は ―を入力)	左記理由	対応国際規格との整合 【凡例】 1: IDT 2: MOD 3: NEQ 4: 無(提有)対応国際規格が存在せず、 国際規格に提案中又は提案予定のもの。 5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、 国際規格に提案しないもの。 6: 無(提未)対応国際規格が存在せず、 今後の対応未定のもの。)	備考	素案作成団体
3	C2570-1	直熱形NTCサーミスタ—第1部: 品目別通則	確認	対応国際規格、引用規格及び引用国際規格の改訂があるが、技術的内容の変更の必要はないため、確認とする。	2		一般社団法人 電子情報技術産業協会
4	C2570-2	直熱形NTCサーミスタ—第2部: 品種別通則—表面実装形NTCサーミスタ	確認	対応国際規格IEC 60539-2 ED2のJIS発行が2019年8月に発行されたのでその内容を基に改正を行う予定である。2020年度以降のJIS案作成開始となるため、確認とする。	2	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会
5	C5005-2	品質評価システム—第2部: 電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式の選択及び活用(統計的工品質限界の評価手順)	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
6	C5101-3	電子機器用固定コンデンサ—第3部: 品種別通則: 表面実装用固定タンタル固体(MnO2)電解コンデンサ	確認	対応国際規格が改訂されたが、2020年度にこの規格の改正の着手を検討するために、確認とする。	1	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会
7	C5101-3-1	電子機器用固定コンデンサ—第3-1部: ブランク個別規格: 表面実装用固定タンタル固体(MnO2)電解コンデンサ 評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
8	C5101-4-1	電子機器用固定コンデンサ—第4-1部: ブランク個別規格: アルミニウム非固体電解コンデンサ—評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
9	C5101-4-2	電子機器用固定コンデンサ—第4-2部: ブランク個別規格: アルミニウム固体(MnO2)電解コンデンサ—評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、技術的内容の変更の必要が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
10	C5101-18-1	電子機器用固定コンデンサ—第18-1部: ブランク個別規格: 表面実装用固定アルミニウム固体(MnO2)電解コンデンサ—評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
11	C5101-18-2	電子機器用固定コンデンサ—第18-2部: ブランク個別規格: 表面実装用固定アルミニウム非固体電解コンデンサ—評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会

【JIS書誌情報】

↓記号の説明は、凡例シートをご参照。

書誌情報			参照文書 (JSA調査結果)			対応国際規格	対応国際規格の 同等性	制定年月日	最新改正日
規格番号及び 西暦年	最新 公示		対応 国際 規格	引用 JIS	引用 国際 規格				
	種類	年月日							
JIS C 0806-6:2006	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60286-6:2004	MOD	2006/03/25	
JIS C 2570-1:2015	改正	2015/11/20	×	×	×	IEC 60539-1:2008	MOD	2006/01/20	2015/11/20
JIS C 2570-2:2015	改正	2015/11/20	◎	×	-	IEC 60539-2:2003/AMENDMENT 1:2010	MOD	2008/05/20	2015/11/20
JIS C 5005-2:2010	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 61193-2:2007	IDT	2010/05/20	
JIS C 5101-3:2010	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60384-3:2006	IDT	1998/07/20	2010/06/21
JIS C 5101-3-1:2010	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60384-3-1:2006	IDT	1998/07/20	2010/06/21
JIS C 5101-4-1:2010	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60384-4-1:2007	IDT	1998/07/20	2010/06/21
JIS C 5101-4-2:2010	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60384-4-2:2007	IDT	1998/07/20	2010/06/21
JIS C 5101-18-1:2010	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60384-18-1:2007	IDT	1999/02/20	2010/06/21
JIS C 5101-18-2:2010	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60384-18-2:2007	IDT	1999/02/20	2010/06/21

12	C5101-20-1	電子機器用固定コンデンサ—第20—1部: ブランク個別規格: 表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ 評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5101-20-1:2010	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60384-20-1:2008	IDT	2000/04/20	2010/06/21
13	C5101-21-1	電子機器用固定コンデンサ—第21—1部: ブランク個別規格: 表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類1 評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5101-21-1:2006	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60384-21-1:2004	IDT	2006/03/25	
14	C5101-22-1	電子機器用固定コンデンサ—第22—1部: ブランク個別規格: 表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類2 評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5101-22-1:2006	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60384-22-1:2004	IDT	2006/03/25	
15	C5201-1	電子機器用固定抵抗器—第1部: 品目別通則	確認	対応国際規格の改訂がFDISまで進行しており、2020年度以降にJIS案作成を行う予定のため、確認とする。	2	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5201-1:2011	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 60115-1:2008	MOD	1998/02/20	2011/01/20
16	C5201-9	電子機器用固定抵抗器—第9部: 品目別通則: 個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5201-9:2006	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60115-9:2003	IDT	2006/03/25	
17	C5201-9-1	電子機器用固定抵抗器—第9—1部: ブランク個別規格: 個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器—評価水準EZ	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5201-9-1:2006	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60115-9-1:2003	IDT	2006/03/25	
18	C5381-311	低圧サージ防護デバイス用部品—第311部: ガス入り放電管 (GDT) の要求事項及び試験回路	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格等は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5381-311:2016	改正	2016/3/22	◎	×	×	IEC 61643-311:2013	IDT	2004/03/20	2016/03/22
19	C5381-312	低圧サージ防護デバイス用部品—第312部: ガス入り放電管 (GDT) の選定及び適用基準	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5381-312:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	-	IEC 61643-312:2013	IDT	2016/03/22	
20	C5401-1	電子機器用コネクタ—製品要求事項—第1部: 品目別通則	確認	対応国際規格の2019年改訂が追補の発行であること、及びIEC/SC48Bにおいてこの規格を含む幾つかの総則及び通則の見直しに言及していることから、その見直しの方向性が明確になった後、改正要否を判断するため確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5401-1:2015	改正	2015/11/20	×	×	×	IEC 61076-1:2006	IDT	2005/03/20	2015/11/20
21	C5401-2	電子機器用コネクタ—第2部: 品目別通則—丸形コネクタ—品質評価付	確認	対応国際規格、引用規格、引用国際規格の改訂/改正に伴い、JIS改正が必要であるが、2020年度以降のJIS案作成となるため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5401-2:2005	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 61076-2:1998	IDT	2005/12/20	
22	C5401-2-001	電子機器用コネクタ—第2—001部: 丸形コネクタ—品質評価付—ブランク個別規格	確認	対応国際規格、引用規格、引用国際規格の改訂/改正に伴い、JIS改正が必要であるが、2020年度以降のJIS案作成となるため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5401-2-001:2005	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 61076-2-001:2001	IDT	2005/12/20	
23	C5401-3	電子機器用コネクタ—第3部: 品目別通則—角形コネクタ—品質評価付	確認	対応国際規格、引用規格、引用国際規格の改訂/改正に伴い、JIS改正が必要であるが、2020年度以降のJIS案作成となるため、確認とする。	1	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5401-3:2005	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 61076-3:1999	IDT	2005/12/20	

24	C5401-3-001	電子機器用コネクタ—第3—001部:角形コネクタ—品質評価付—ブランク個別規格	確認	対応国際規格、引用規格、引用国際規格の改訂/改正に伴い、JIS改正が必要であるが、2020年度以降のJIS案作成となるため、確認とする。	1	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5401-3-001:2005	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 61076-3-001:1999	IDT	2005/12/20	
25	C5402-2-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2—5部:導通及び接触抵抗試験—試験2e:コンタクトディスク—ターバンス	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-2-5:2005	確認	2015/10/20	◎	-	-	IEC 60512-2-5:2003	IDT	2005/12/20	
26	C5402-4-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第4—1部:電圧ストレス試験—試験4a:耐電圧	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-4-1:2005	確認	2015/10/20	◎	-	-	IEC 60512-4-1:2003	IDT	2005/12/20	
27	C5402-7-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第7—1部:衝撃試験(可動形コネクタ)—試験7a:自由落下(繰返し)	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-7-1:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	-	IEC 60512-7-1:2010	IDT	2016/03/22	
28	C5402-8-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8—1部:静的な力試験(固定形コネクタ)—試験8a:静的な力、横方向	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-8-1:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	-	IEC 60512-8-1:2010	IDT	2016/03/22	
29	C5402-8-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8—3部:静的な力試験(固定形コネクタ)—試験8c:操作レバーの強度	確認	対応国際規格の改訂に伴い、JIS改正が必要であるが、2020年度以降のJIS案作成となるため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-8-3:2016	制定	2016/3/22	×	◎	-	IEC 60512-8-3:2011	IDT	2016/03/22	
30	C5402-9-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第9—1部:耐久試験—試験9a:機械的動作	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-9-1:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	-	IEC 60512-9-1:2010	IDT	2016/03/22	
31	C5402-10-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第10—4部:インパクト試験(可動形部品)、静的負荷試験(固定形部品)、耐久試験及び過負荷試験—試験10d:電氣的過負荷(コネクタ)	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-10-4:2006	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 60512-10-4:2003	IDT	2002/03/20	2006/03/25
32	C5402-11-7	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11—7部:耐候性試験—試験11g:混合ガス流腐食	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-11-7:2006	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60512-11-7:2003	IDT	2002/03/20	2006/03/25
33	C5402-11-14	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11—14部:耐候性試験—試験11p:単一ガス流腐食	確認	対応国際規格の改訂が無く、引用規格は改正されているが、技術的内容の変更の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-11-14:2006	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60512-11-14:2003	IDT	2002/03/20	2006/03/25
34	C5402-13-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第13—1部:機械的動作試験—試験13a:結合力及び離脱力	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-13-1:2015	改正	2015/11/20	◎	◎	-	IEC 60512-13-1:2006	IDT	2002/03/20	2015/11/20
35	C5402-14-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第14—2部:封止(気密性)試験—試験14b:封止(気密性)—微小エアリーク	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-14-2:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	-	IEC 60512-14-2:2006	IDT	2016/03/22	

36	C5402-14-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第14-4部: 封止(気密性)試験—試験14d: 浸せき—防水	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-14-4:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	-	IEC 60512-14-4:2006	IDT	2016/03/22	
37	C5402-14-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第14-5部: 封止(気密性)試験—試験14e: 浸せき(減圧)	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-14-5:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	-	IEC 60512-14-5:2006	IDT	2016/03/22	
38	C5402-14-6	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第14-6部: 封止(気密性)試験—試験14f: インタフェシャルシーリング	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-14-6:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	-	IEC 60512-14-6:2006	IDT	2016/03/22	
39	C5402-16-8	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16-8部: コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16h: インシュレーショングリップの有効性(圧着接続)	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-16-8:2015	制定	2015/4/20	◎	×	-	IEC 60512-16-8:2008	IDT	2015/04/20	
40	C5402-16-9	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16-9部: コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16i: 接地コンタクトスプリングの保持力	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-16-9:2015	制定	2015/4/20	◎	◎	-	IEC 60512-16-9:2008	IDT	2015/04/20	
41	C5402-16-13	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16-13部: コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16m: ラッピングの巻き戻し、無はんだラッピング接続	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-16-13:2015	制定	2015/4/20	◎	◎	◎	IEC 60512-16-13:2008	IDT	2015/04/20	
42	C5402-17-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第17-1部: ケーブルランプ試験—試験17a: ケーブルランプ強度	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-17-1:2015	制定	2015/4/20	◎	◎	-	IEC 60512-17-1:2010	IDT	2015/04/20	
43	C5402-17-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第17-2部: ケーブルランプ試験—試験17b: ケーブルランプ強度(ケーブルの回転)	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-17-2:2015	制定	2015/4/20	◎	◎	-	IEC 60512-17-2:2011	IDT	2015/04/20	
44	C5402-17-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第17-4部: ケーブルランプ試験—試験17d: ケーブルランプ強度(ケーブルのねじり)	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-17-4:2015	制定	2015/4/20	◎	◎	-	IEC 60512-17-4:2010	IDT	2015/04/20	
45	C5402-23-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第23-4部: スクリーニング及びフィルタリング試験—試験23d: 時間領域での伝送線路の反射	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5402-23-4:2006	確認	2015/10/20	◎	-	-	IEC 60512-23-4:2001	IDT	2006/03/25	
46	C5412	高周波同軸CO2形コネクタ	確認	引用規格のC5410が改正されているが、2020年度にこの規格の改正に着手を検討するために、確認とする。	5	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5412:1995	確認	2015/10/20	-	×	-			1970/10/01	1995/11/01
47	C5413	高周波同軸CO3形コネクタ	確認	引用規格のC5410が改正されているが、2020年度にこの規格の改正に着手を検討するために、確認とする。	5	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5413:1995	確認	2015/10/20	-	×	-			1970/10/01	1995/11/01

48	C5414	高周波同軸C04形コネクタ	確認	引用規格のC5410が改正されているが、2020年度にこの規格の改正に着手を検討するために、確認とする。	5	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5414:1995	確認	2015/10/20	-	×	-			1970/10/01	1995/11/01
49	C5415	高周波同軸C05形コネクタ	確認	引用規格のC5410が改正されているが、2020年度にこの規格の改正に着手を検討するために、確認とする。	5	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5415:1995	確認	2015/10/20	-	×	-			1970/10/01	1995/11/01
50	C5419	高周波同軸C11形コネクタ	確認	引用規格のC5410が改正されているが、2020年度にこの規格の改正に着手を検討するために、確認とする。	5	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5419:1995	確認	2015/10/20	-	×	-			1970/10/01	1995/11/01
51	C5432	電子機器用丸形R01コネクタ	確認	引用規格の廃止に伴い、JIS改正が必要であるが、2020年度以降のJIS案作成となるため、確認とする。	5	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5432:1994	確認	2015/10/20	-	×	-			1970/03/01	1994/03/01
52	C5502	マイクロホン	確認	引用規格の改正があるが、技術的内容の変更はないため、確認とする。	5		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5502:1991	確認	2015/10/20	-	×	-			1952/06/21	1991/02/01
53	C5569	録音再生機器における速変動の測定方法	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5569:1991	確認	2015/10/20	◎	-	-	IEC 60386:1972	IDT	1991/02/01	
54	C5602	電子機器用受動部品用語	確認	対応国際規格は存在しないが、多くのIEC TCのJIS、書類などで引用されており、必要なJISであり、技術的内容の変更が必要ないため、確認とする。	6		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5602:1986	確認	2015/10/20	-	×	-			1986/02/01	
55	C5610	集積回路用語	確認	規格の改正及び廃止がなく、また、技術的内容の変更はないため、確認とする。	5		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 5610:1996	確認	2015/10/20	-	-	-			1972/06/01	1996/08/01
56	C5630-20	マイクロマシン及びMEMS—第20部：小型ジャイロ	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般財団法人マイクロマシンセンター	JIS C 5630-20:2015	制定	2015/11/20	◎	-	-	IEC 62047-20:2014	IDT	2015/11/20	
57	C5750-3-4	ディペンダビリティ マネジメント—第3-4部：適用の指針—ディペンダビリティ要求事項仕様書作成の指針	確認	基礎となる対応国際規格は存続しており、引用規格の変更は最新版に読み換えることで支障は無いため、確認とする。	2		無	JIS C 5750-3-4:2011	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 60300-3-4:2007	MOD	2003/11/20	2011/01/20
58	C5750-3-5	ディペンダビリティ管理—第3-5部：適用の指針—信頼性試験条件及び統計的方法に基づく試験原則	確認	基礎となる対応国際規格は存続しており、引用規格の変更は最新版に読み換えることで支障は無いため、確認とする。	1		無	JIS C 5750-3-5:2006	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 60300-3-5:2001	IDT	2006/03/25	
59	C5750-4-3	ディペンダビリティ マネジメント—第4-3部：システム信頼性のための解析技法—故障モード・影響解析(FMEA)の手順	確認	対応国際規格が改訂されたが、2020年度にこの規格の改正の着手を検討するために、確認とする。	1	暫定確認	無	JIS C 5750-4-3:2011	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60812:2006	IDT	2011/01/20	

60	C5750-4-4	ディペンダビリティ マネジメント—第4—4部:システム信頼性のための解析技法—故障の木解析 (FTA)	確認	基礎となる対応国際規格は存続しており、引用規格の変更は最新版に読み換えることで支障は無いため、確認とする。	1		無
61	C5871	干渉フィルタ試験方法	確認	引用JISの内、JISC0025がJISC60068-2-14に置き換えられ、JISC5860、JISC5900、JISC60068-1及びJISC60068-2-78が改正されているが、技術的影響はないため、確認とする。	5		一般財団法人 光産業技術振興協会
62	C5912	波長スイッチ通則	確認	引用JISの内、JISC5900が改正されているが、技術的影響はないため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
63	C5920-1	光伝送用パワー制御受動部品—第1部:通則	確認	対応国際規格が改訂されているが、国内に流通していない製品の技術情報に関する部分の改訂のため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
64	C5925-1	光伝送用WDMデバイス—第1部:通則	確認	引用JISの内、C5900及びC61300規格群が改正/制定されているが、技術的影響はないため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
65	C5925-3	シングルモードファイバビグテール形C/LバンドWDMデバイス	確認	引用規格のC61300-2-17、C61300-2-19などが改正中であり、それらの改正作業後にこの規格の改正要否を判断するため、確認とする。	2	暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会
66	C5925-4	シングルモードファイバビグテール形980/1550nmWWDMデバイス	確認	引用規格のC61300-2-17、C61300-2-19などが改正中であり、それらの改正作業後にこの規格の改正要否を判断するため、確認とする。	2	暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会
67	C5930-1	光伝送用スイッチ—第1部:通則	確認	引用JISの内、C5931がC5930-2に置き換えられ、C5630-1及びC61300規格群が改正/制定されているが、技術的影響はないため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
68	C5942	再生用及び記録用半導体レーザ通則	確認	対応国際規格IEC 60747-5-2がほかのIECに置き換えられ、また、引用規格の一部が改正・廃止されたが、技術的内容の変更はないため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
69	C5943	再生用及び記録用半導体レーザ測定方法	確認	引用規格の一部が改正されたが、技術的内容の変更はないため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
70	C5976	F07形2心ファイバコネクタ	確認	引用JISの内、C5961、C5962及びC6820が改正され、C5963が廃止されたが、技術的影響がないため、確認とする。	1		一般財団法人 光産業技術振興協会
71	C5987	F18形光ファイバコネクタ	確認	引用JISの内、B0601、C5961、C5962及びC6820が改正されたが、技術的影響がないため、確認とする。	5		一般財団法人 光産業技術振興協会

JIS C 5750-4-4:2011	確認	2015/10/20	◎	×	◎	IEC 61025:2006	IDT	2011/01/20	
JIS C 5871:2011	確認	2015/10/20	-	×	-			1992/09/01	2011/01/20
JIS C 5912:2006	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 62099:2001	MOD	2006/03/25	
JIS C 5920-1:2015	制定	2015/11/20	×	×	-	IEC 60869-1:2012	MOD	2015/11/20	
JIS C 5925-1:2016	改正	2016/3/22	◎	×	-	IEC 62074-1:2014	MOD	2011/10/20	2016/03/22
JIS C 5925-3:2011	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 61753-083-2:2007	MOD	2011/01/20	
JIS C 5925-4:2011	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 61753-084-2:2007/Technical Corrigendum 1:2008	MOD	2011/01/20	
JIS C 5930-1:2016	制定	2016/3/22	◎	×	-	IEC 60876-1:2014	MOD	2016/03/22	
JIS C 5942:2010	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 60747-5-4:2006;IEC 60747-5-2:1997	MOD;MOD	1990/01/01	2010/05/20
JIS C 5943:2010	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 60747-5-4:2006	MOD	1990/01/01	2010/05/20
JIS C 5976:2001	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 61754-16:1999	IDT	1990/06/01	2001/03/20
JIS C 5987:2005	確認	2015/10/20	-	×	-			2005/12/20	

72	C6011-1	電子装置用きょう体の試験方法—第1部:屋内設置のキャビネット、ラック、サブラック及びシヤシの耐環境性能の試験及び安全性の評価	確認	現行の対応国際規格は2016年12月に改訂版が発行されたが、その時点で再度改訂が予定されており、現在その作業中である。その改訂が済んだ後にJISの改正の要否を検討するため、確認とする。	1	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会
73	C6011-2	電子装置用きょう体の試験方法—第2部:キャビネット及びラックの耐震試験方法	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
74	C6011-3	電子装置用きょう体の試験方法—第3部:キャビネット及びサブラックの電磁シールド性能試験方法	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
75	C6012-3-100	電子機器用の機械的構造—482. 6mm(19in)シリーズの機械的構造寸法—フロントパネル、サブラック、シヤシ、ラック及びキャビネットの基本寸法	確認	対応国際規格の改訂が無く、JIS改正の必要性が認められないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
76	C6114-1	光変調器モジュール通則	確認	対応国際規格が改正され、また、引用規格の一部が改正・廃止されたが、技術的内容の変更はないため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
77	C6114-2	光変調器モジュール測定方法	確認	引用規格の一部が改正されたが、技術的内容の変更はないため、確認とする。	5		一般財団法人 光産業技術振興協会
78	C6115-1	pin-FETモジュール通則	確認	対応国際規格が改正され、また、引用規格の一部が改正・廃止されたが、技術的内容の変更はないため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
79	C6115-2	pin-FETモジュール測定方法	確認	対応国際規格が改正され、また、引用規格の一部が改正されたが、技術的内容の変更はないため、確認とする。	2		一般財団法人 光産業技術振興協会
80	C6122-1-1	光増幅器—測定方法—第1-1部:パワーパラメータ及び利得パラメータ—光スペクトラムアナライザ法	確認	対応国際規格が改訂作業中であり、改訂後に改正を予定しているが、2020年度内の改訂版発行を見込んでいるため、確認とする。	1	暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会
81	C6122-1-2	光増幅器—測定方法—第1-2部:パワーパラメータ及び利得パラメータ—電気スペクトラムアナライザ法	確認	引用国際規格のIEC 60793-1-40が改訂されたが、技術的な影響はなく、確認とする。	1		一般財団法人 光産業技術振興協会
83	C6122-3	光増幅器—測定方法—第3部:雑音指数パラメータ	確認	対応国際規格、引用JIS、引用国際規格の改訂/改正はなく、確認とする。	1		一般財団法人 光産業技術振興協会
84	C6122-3-2	光増幅器—測定方法—第3-2部:雑音指数パラメータ—電気スペクトラムアナライザ試験方法	確認	対応国際規格の改訂、引用JISの改正、引用国際規格の改訂があるが、対応国際規格の適用範囲の拡大並びに、用語及び略語の移動だけであり、技術的な影響がないため、確認とする。	1		一般財団法人 光産業技術振興協会

JIS C 6011-1:2015	改正	2015/11/20	×	×	×	IEC 61587-1:2011	IDT	2011/01/20	2015/11/20
JIS C 6011-2:2015	改正	2015/11/20	◎	×	×	IEC 61587-2:2011	IDT	2011/01/20	2015/11/20
JIS C 6011-3:2015	改正	2015/11/20	◎	×	×	IEC 61587-3:2013	IDT	2011/01/20	2015/11/20
JIS C 6012-3-100:2015	制定	2015/11/20	◎	◎	◎	IEC 60297-3-100:2008	IDT	2015/11/20	
JIS C 6114-1:2006	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 62007-1:1999	MOD	2006/01/20	
JIS C 6114-2:2006	確認	2015/10/20	-	×	-			2006/01/20	
JIS C 6115-1:2006	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 62007-1:1999	MOD	2006/01/20	
JIS C 6115-2:2006	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 62007-2:1999	MOD	2006/01/20	
JIS C 6122-1-1:2011	確認	2015/10/20	×	◎	-	IEC 61290-1-1:2006	IDT	2011/03/22	
JIS C 6122-1-2:2011	確認	2015/10/20	◎	◎	×	IEC 61290-1-2:2005	IDT	2011/03/22	
JIS C 6122-3:2011	確認	2015/10/20	◎	◎	◎	IEC 61290-3:2008	IDT	2001/08/20	2011/03/22
JIS C 6122-3-2:2006	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 61290-3-2:2003	IDT	2006/01/20	

85	C6122-5-1	光ファイバ増幅器—測定方法—第5-1部:光反射率パラメータ測定方法—光スペクトラムアナライザを用いた測定方法	確認	対応国際規格が改訂、引用JISの改正があるが、対応国際規格の適用範囲の拡大だけのため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6122-5-1:2001	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 61290-5-1:2000	IDT	2001/08/20	
86	C6122-11-1	光増幅器—測定方法—第11-1部:偏波モード分散パラメータ—ジョーンズマトリクス固有値解析(JME)法	確認	対応国際規格の改訂はなく、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6122-11-1:2010	確認	2015/10/20	◎	-	-	IEC 61290-11-1:2008	IDT	2010/05/20	
87	C6180	レーザ出力測定方法	確認	引用JISの改正は軽微であり、本規格の技術的内容の変更は必要ないため、確認とする。	5	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6180:1991	確認	2015/10/20	-	×	-			1991/08/01	
88	C6181	レーザ放射パワー及びエネルギー測定用検出器、測定器及び測定装置	確認	対応国際規格が廃止されたため、廃止しても問題ないか検討の上、2020年度以降に廃止手続きに着手する予定であるため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6181:1995	確認	2015/10/20	×	-	×	IEC 61040:1990	IDT	1995/01/01	
89	C6182	レーザビーム用光パワーメータ試験方法	確認	対応国際規格が廃止されている。利害関係者に確認中であり、廃止しても問題ないことなどが立ち次第、2020年度以降に廃止手続きに着手する予定であるため、確認とする。	3	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6182:1991	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 61040:1990	NEQ	1991/08/01	
90	C6443	普通級炭素系可変抵抗器	確認	対応国際規格の改訂や引用規格の改正が行われているが、技術的内容の修正の必要がないため、確認とする。	2	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 6443:1995	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60393-5:1992	MOD	1959/10/01	1995/11/01
91	C6444	電子機器用炭素系混合体可変抵抗器—特性Y、W及びUC	確認	対応国際規格の改訂や引用規格の改正が行われているが、技術的内容の修正の必要がないため、確認とする。	3	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 6444:1991	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60393-5:1992	NEQ	1959/10/01	1991/01/01
92	C6445	巻線形可変抵抗器	確認	対応国際規格の改訂や引用規格の改正が行われているが、技術的内容の修正の必要がないため、確認とする。	2	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 6445:1995	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60393-5:1992	MOD	1960/03/01	1995/11/01
93	C6461	電子機器用可変コンデンサ品目別通則	確認	対応国際規格の改訂や引用規格の改正が行われているが、技術的内容の修正の必要がないため、確認とする。	2	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 6461:1996	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60418-1:1974/AMENDMENT 2:1981:IEC 60418-2:1976/AMENDMENT 1:1981:IEC 60418-3:1976:IEC 60418-4:1976	MOD;MOD;MOD;M	1984/01/01	1996/04/01
94	C6462	電子機器用可変コンデンサの試験方法	確認	対応国際規格の改訂や引用規格の改正が行われているが、技術的内容の修正の必要がないため、確認とする。	2	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 6462:1996	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60418-1:1974/AMENDMENT 2:1981:IEC 60418-2:1976/AMENDMENT 1:1981:IEC 60418-3:1976:IEC 60418-4:1976	MOD;MOD;MOD;M	1984/01/01	1996/04/01
95	C6560	単頭プラグ・ジャック	確認	対応国際規格の改訂及び引用規格の廃止に伴い、JIS改正が必要だが、2020年度以降のJIS案作成となるため、確認とする。	3	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 6560:1994	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60130-8:1976:IEC 60603-11:1992	NEQ;NEQ	1968/01/01	1994/03/01
96	C6831	光ファイバ心線	確認	引用規格の対応国際規格が改訂中のため、それらの改訂完了後にこの規格の改正要否を検討する。時期は2021年以降になるため、確認とする。	2	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6831:2001	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60793-2:1998:IEC/CDV 60794-3 Ed.3.0:2000	MOD;MOD	1989/03/01	2001/08/20

98	C6850	光ファイバケーブル通則	確認	対応国際規格の改訂を受けてこの規格を見直すこととしているが、改正申出・公示予定時期が2021年度以降となるため、確認とする。	2	暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6850:2006	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 60794-1-1:2001	MOD	2001/03/20	2006/01/20
99	C6870-3-10	光ファイバケーブル—第3-10部：屋外ケーブル—ダクト・直埋用及びラッシング形架空用光ファイバケーブル品種別通則	確認	対応国際規格の改訂を受けてこの規格を見直すこととしているが、改正申出・公示予定時期が2021年度以降となるため、確認とする。	2	暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6870-3-10:2011	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 60794-3-10:2009	MOD	2011/01/20	
100	C6870-3-20	光ファイバケーブル—第3-20部：屋外ケーブル—自己支持形架空用光ファイバケーブル品種別通則	確認	対応国際規格の改訂を受けてこの規格を見直すこととしているが、改正申出・公示予定時期が2021年度以降となるため、確認とする。	2	暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 6870-3-20:2011	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 60794-3-20:2009	MOD	2011/01/20	
101	C9914	オーディオ、ビデオ、情報及び通信技術機器—環境配慮設計	確認	対応国際規格の改訂があり、JIS化を検討中であるが、改正申出・公示予定時期が2021年度以降となるため、確認とする。	1	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 9914:2010	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 62075:2008	IDT	2010/07/20	
102	C60068-2-20	環境試験方法—電気・電子—第2-20部：試験—試験T—端子付部品のはんだ付け性及びはんだ耐熱性試験方法	確認	対応国際規格の改訂がなく、引用規格の改正等は技術的内容に影響しないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会	JIS C 60068-2-20:2010	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 60068-2-20:2008	IDT	1985/11/01	2010/05/20
103	C60068-2-45	環境試験方法—電気・電子—耐溶剤性（洗浄溶剤浸せき）試験方法	確認	対応国際規格の最新版に対応しており、技術的改正の必要はないため、確認とする。	1		無	JIS C 60068-2-45:1995	確認	2015/10/20	◎	-	-	IEC 60068-2-45:1980/AMENDMENT 1:1993	IDT	1986/08/01	1995/03/01
108	C61280-2-8	光ファイバ通信サブシステム試験方法—Q値測定を用いた低ビット誤り率の決定法	確認	対応国際規格の改訂はなく、技術的内容の変更はないため、確認とする。	1		一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 61280-2-8:2010	確認	2015/10/20	◎	-	-	IEC 61280-2-8:2003	IDT	2010/05/20	
109	C61280-2-9	光ファイバ通信サブシステム試験方法—高密度波長分割多重システムの光信号対雑音比測定	確認	対応国際規格が改訂され、フィルタリングによる測定誤差に関する追加が主な変更点であるが、これは参考情報を附属書として追加したものであり、実質的に光信号対雑音比を測る試験法には影響を及ぼさないため、確認とする。	1		一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 61280-2-9:2010	確認	2015/10/20	×	-	×	IEC 61280-2-9:2002	IDT	2010/05/20	
110	C61280-2-11	光ファイバ通信サブシステム試験方法—光信号品質評価のための強度ヒストグラム評価を用いた平均化Q値測定	確認	対応国際規格及び引用国際規格に変更がなく、引用国際規格の改正は技術的内容に影響を及ぼさないため、確認とする。	1		一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 61280-2-11:2010	確認	2015/10/20	◎	-	×	IEC 61280-2-11:2006	IDT	2010/05/20	
111	C61280-4-4	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第4-4部：ケーブル設備及びリンク—既設リンクの偏波モード分散測定	確認	対応国際規格は改訂されており、改訂箇所が多岐にわたるので、この規格の改正を行う必要があるが、申出・公示予定時期が2021年度以降になるため、確認とする。	1	暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 61280-4-4:2015	制定	2015/11/20	×	-	◎	IEC 61280-4-4:2006	IDT	2015/11/20	
112	C61281-1	光ファイバ通信サブシステム通則	確認	対応国際規格は改訂されており、データコムに対応した記載を追加する等が行われているので、この規格の改正を行う必要があるが、申出・公示予定時期が2021年度以降になるため、確認とする。	1	暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 61281-1:2010	確認	2015/10/20	×	×	×	IEC 61281-1:1999	IDT	2010/05/20	
113	C61300-2-2	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-2部：繰返しかん合試験	確認	引用JISの内、C61300-3-4が改正されたが、技術的影響がないため、確認とする。	1		一般財団法人 光産業技術振興協会	JIS C 61300-2-2:2011	確認	2015/10/20	◎	×	◎	IEC 61300-2-2:2009	IDT	2011/03/22	

114	C61300-2-12	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-12部:落下衝撃試験	確認	引用JISの内、C61300-3-4が改正されたが、技術的影響がないため、確認とする。	2	一般財団法人 光産業技術振興協会
115	C61300-2-24	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-24部:応力印加によるセラミック割リスリーブのスクリーニング試験	確認	対応国際規格が変更されておらず、引用JIS及び引用国際規格がないため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会
116	C61300-2-40	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-40部:SM調心円筒形斜めPC端面光ファイバコネクタプラグの挿入損失スクリーニング試験	確認	引用JIS(C61300-3-4)が改正されたが、技術的影響がないため、確認とする。	2	一般財団法人 光産業技術振興協会
117	C61300-2-41	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-41部:SM調心円筒形直角PC端面光ファイバコネクタプラグの挿入損失スクリーニング試験	確認	引用JIS(C61300-3-4)が改正されたが、技術的影響がないため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会
118	C61300-2-44	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-44部:光ファイバクランプ強度試験—繰返し曲げ	確認	引用JISの内、C61300-1及びC61300-3-4が改正されたが、技術的影響がないため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会
119	C61300-2-46	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-46部:湿熱サイクル試験	確認	対応国際規格が改訂されており、電子部品の規定と整合を取るために、規定の値を含む技術的な変更がされているので、この規格の改正を行う必要があるが、申出・公示予定時期が2021年度以降になるため、確認とする。	1 暫定確認	一般財団法人 光産業技術振興協会
120	C61300-3-6	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-6部:反射減衰量測定	確認	引用JISの内、C61300-1が改正されているが、技術的影響はないため、確認とする。	2	一般財団法人 光産業技術振興協会
121	C61300-3-21	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-21部:切替時間測定	確認	引用JISの内、C61300-1が改正されているが、技術的影響はない。また、C61300-3-4が改正されているが、改正後の最新版を引用するのが妥当であるため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会
122	C61300-3-26	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-26部:光ファイバとフェルルール軸との角度ずれの測定	確認	引用JISのB0615がB0615-1及びB0615-2に分割されたが、技術的影響がないため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会
123	C61300-3-30	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-30部:多心光ファイバコネクタ用フェルルールの研磨角度及び光ファイバ位置測定	確認	対応国際規格が変更されておらず、引用JIS及び引用国際規格がないため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会
124	C61300-3-38	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-38部:群遅延、波長分散及び位相リップルの測定	確認	対応国際規格、引用規格に変更がないため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会
125	C61300-3-50	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-50部:光スイッチのクロストーク測定	確認	引用JISの内、C61300-1が改正されているが、技術的影響はないため、確認とする。	1	一般財団法人 光産業技術振興協会

JIS C 61300-2-12:2011	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 61300-2-12:2009	MOD	2011/01/20
JIS C 61300-2-24:2016	制定	2016/3/22	◎	-	-	IEC 61300-2-24:2010	IDT	2016/03/22
JIS C 61300-2-40:2015	制定	2015/11/20	◎	×	-	IEC 61300-2-40:2000	MOD	2015/11/20
JIS C 61300-2-41:2015	制定	2015/11/20	◎	×	-	IEC 61300-2-41:1998	IDT	2015/11/20
JIS C 61300-2-44:2015	制定	2015/11/20	◎	×	-	IEC 61300-2-44:2013	IDT	2015/11/20
JIS C 61300-2-46:2011	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 61300-2-46:2006	IDT	2011/03/22
JIS C 61300-3-6:2011	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 61300-3-6:2008	MOD	2011/01/20
JIS C 61300-3-21:2016	制定	2016/3/22	◎	×	-	IEC 61300-3-21:2014	IDT	2016/03/22
JIS C 61300-3-26:2011	確認	2015/10/20	◎	×	-	IEC 61300-3-26:2002	IDT	2011/03/22
JIS C 61300-3-30:2010	確認	2015/10/20	◎	-	-	IEC 61300-3-30:2003	IDT	2010/05/20
JIS C 61300-3-38:2015	制定	2015/11/20	◎	-	◎	IEC 61300-3-38:2012	IDT	2015/11/20
JIS C 61300-3-50:2016	制定	2016/3/22	◎	×	-	IEC 61300-3-50:2013/CORRIGENDUM 2:2015	IDT	2016/03/22

126	C62024-1	高周波誘導部品—電気的特性及び測定方法—第1部:ナノヘンリー範囲の表面実装インダクタ	確認	対応国際規格の改訂があり、JIS化を検討中であるが、改正申出・公示予定時期が2021年度以降となるため、確認とする。	1	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会
127	C62025-1	高周波誘導部品—非電気特性及び測定方法—第1部:電子機器及び通信機器用表面実装固定インダクタ及びフェライトビーズ	確認	対応国際規格の改訂がなく、JISの改正の必要性がないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
128	C62137-1-1	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-1部:引きはがし強度試験方法	確認	対応国際規格の改訂がなく、引用規格の改正等があるが技術的内容に影響を及ぼさないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
129	C62137-1-2	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-2部:横押しせん断強度試験方法	確認	対応国際規格の改訂がなく、引用規格の改正等があるが技術的内容に影響を及ぼさないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
130	C62137-4	電子実装技術—第4部:エリアアレイ形表面実装部品のはんだ接合部耐久性試験方法	確認	対応国際規格の改訂がなく、引用国際規格の改正等があるが技術的内容に影響を及ぼさないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
131	C62448	マルチメディアのシステム及び機器—マルチメディアの電子出版及び電子書籍—電子出版のための共通フォーマット	確認	対応国際規格が改訂されており、この規格の改正を検討するが、申出・公示予定時期は2022年度以降になるので、確認とする。	1	暫定確認	一般社団法人 電子情報技術産業協会
132	C62739-1	溶融鉛フリーはんだを用いたウエーブソルダリング装置の侵食試験方法—第1部:表面処理を施さない金属材料の侵食試験方法	確認	対応国際規格の改訂がなく、引用国際規格の改正等があるが技術的内容に影響を及ぼさないため、確認とする。	1		一般社団法人 電子情報技術産業協会
135	C5750-2	ディベンダビリティ マネジメント—第2部:ディベンダビリティ マネジメントのための指針	確認	対応国際規格の改訂後、C5750-1を改正しそれに伴い本JISの廃止を検討する予定である。対応国際規格の改正にしばらく時間がかかることから、今回は確認する。	2	暫定確認	無

JIS C 62024-1:2011	確認	2015/10/20	×	×	-	IEC 62024-1:2008	IDT	2006/03/25	2011/01/20
JIS C 62025-1:2011	確認	2015/10/20	◎	◎	-	IEC 62025-1:2007	IDT	2006/03/25	2011/01/20
JIS C 62137-1-1:2010	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 62137-1-1:2007	IDT	2010/05/20	
JIS C 62137-1-2:2010	確認	2015/10/20	◎	×	×	IEC 62137-1-2:2007	IDT	2010/05/20	
JIS C 62137-4:2016	制定	2016/3/22	◎	◎	×	IEC 62137-4:2014	IDT	2016/03/22	
JIS C 62448:2016	制定	2016/3/22	×	◎	-	IEC 62448:2013	IDT	2016/03/22	
JIS C 62739-1:2015	制定	2015/4/20	◎	×	◎	IEC 62739-1:2013	IDT	2015/04/20	
JIS C 5750-2:2010	確認	2014/10/20	×	×	-	IEC 60300-2:2004	MOD	2000/10/20	2010/03/23